Всероссийская открытая научная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн» - Муром 2023

УДК: 537.87

DOI: 10.24412/2304-0297-2023-1-30-40

## Численное моделирование флуктуации параметров луча в ионосфере с регулярными и статистическими неоднородностями

Д.С. Лукин

Российский новый университет 105005, г. Москва, ул. Радио, 22. E-mail: <u>luknet1@yandex.ru</u>

Рассчитываются флуктуации параметров луча в ионосфере. Численный расчет основывается на известном соответствии между аппаратом стохастических дифференциальных уравнений и уравнением Эйнштейна-Фоккера. Непосредственное интегрирование уравнений луча методом бихарактеристик в предположении о марковости процесса позволяет найти моменты второго порядка и функцию распределения случайных отклонений параметров луча от среднего значения

Ключевые слова: флуктуации, луч, бихарактеристики, статистические моменты, ионосфера

# Numerical simulation of ray parameter fluctuations in a medium with regular and statistical inhomogeneities

D.S. Lukin

Russian New University.

The fluctuations of the ray parameters in the ionosphere are calculated. The numerical calculation is based on the well-known correspondence between the apparatus of stochastic differential equations and the Einstein-Fokker equation. Direct integration of the ray equations by the bicharacteristics method under the assumption that the process is Markovian allows us to find the second-order moments and the distribution function of random deviations of the ray parameters from the mean value.

Keywords: fluctuations, ray, bi-characteristics, statistical moments, ionosphere

### Введение

Лучевое приближение является одним из основных и наиболее эффективных методов исследования распространения и рассеяния радиоволн в неоднородных средах. Решение многих задач по моделированию характеристик волны в земной ионосфере с учетом случайных неоднородностей, в том числе и расчет флуктуации направления распространения волны в статистически-неоднородной среде, целиком базируется на численном решении бихарактеристической системы [1,2]. Идея этого метода заключается в замене реального случайного процесса рассеяния лучей на неоднородных образованиях среды процессом марковского типа и применении эффективного математического аппарата теории марковских процессов.

Известны два различных подхода к описанию процесса рассеяния в марковском приближении. Один из них опирается на аналогию с хорошо известной статистической схемой, описывающей движение броуновской частицы – уравнение Эйнштейна-Фоккера [3]. Этот подход был предложен в монографии Л.А. Чернова [4] и дальнейшее развитие по лучил в работах С.М. Рытова [5,6], В.Д. Гусева [7,8] для среды в среднем однородной, а также в работах Н.Г. Денисова [9-13], В.М. Комиссарова [14-15], В.Д. Гусева и С.М. Голынского [16-18] для неоднородной в среднем среды. При таком подходе до конца не определенными остаются условия применимости уравнения Эйнштейна-Фоккера.

Второй подход, развитый В.И. Татарским и В.И. Кляцкиным, является математически более строгим. Переход к марковскому процессу базируется на следующих предположениях [19-24]:

• флуктуации диэлектрической проницаемости среды являются гауссовым однородным и изотропным случайным полем со средним значением, равным нулю;

• компоненты корреляционного тензора, описывающего статистические характеристики флуктуации диэлектрической проницаемости, дельта-коррелированы вдоль направления распространения волны. В этом случае показано, что в приближении малоугловых флуктуации уравнение Эйнштейна-Фоккера является логическим следствием лучевых уравнений [19-24].

Круг вопросов, решаемых лучевым методом необычайно широк. В данной работе мы сосредоточим внимание на учете совместного влияния регулярных и статистических неоднородностей на флуктуации параметров электромагнитных волн. Предлагается свести решение ряда задач для широкого класса параметров неоднородной среды к единому численному методу, аналогичному методу характеристик, который бы позволил наряду с численным расчетом регулярного изменения фазы и напряжённости поля на характеристиках (вдоль лучей) определять и статистические параметры волны, не вводя существенных изменений в методику численного расчета.

Для случая плоскослоистой среды учет совместного влияния регулярных и случайных неоднородностей на параметры луча проводился в работах [9-16]. Однако решение ряда задач, таких как учет влияния рефракции в атмосферах Земли, планет и солнечной короне на статистические характеристики излучения космических радиоисточников, расчет флуктуации доплеровского сдвига частоты коротких радиоволн в сферически-слоистой и регулярно-неоднородной ионосфере, требует обобщения результатов на случай трехмерно-неоднородной среды.

В данной работе рассчитываются флуктуации параметров луча в ионосфере, средние характеристики которой зависят от двух координат. Численный расчет флуктуации основывается на известном соответствии между аппаратом стохастических дифференциальных уравнений и уравнением Эйнштейна-Фоккера. Непосредственное интегрирование уравнений луча в предположении о марковости процесса позволяет найти моменты второго порядка и функцию распределения случайных отклонений параметров луча от среднего значения.

## Флуктуации угла прихода

Пренебрегая влиянием магнитного поля Земли, бихарактеристическую систему уравнений для лучевой траектории можно представить в виде [1]:

$$\frac{d\vec{r}}{d\sigma} = \vec{S}, \quad \frac{d(nS)}{d\sigma} = \nabla n_0 \quad . \tag{1}$$

Здесь  $\vec{r}$  – радиус-вектор, определяющий траекторию луча,  $\sigma$  – путь вдоль луча,  $\vec{S}$  – единичный вектор касательный лучу, n – показатель преломления [4].

Пусть  $n = n(\vec{r}) + \mu(\vec{r})$ , где  $n(\vec{r})$  – регулярное значение показателя преломления,  $\mu(\vec{r})$  – случайные отклонения, причем  $|\mu(\vec{r})| \ll n(\vec{r})$ . Предположим, что траектория луча мало отличается от своего среднего значения

$$\vec{S} = \vec{S}_0 + \vec{S}_1, \quad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}_1.$$
 (2)

Отклонения  $\vec{S}_1$  и  $\vec{r}_1$  того же порядка малости, что и  $\mu$ . Подставляя (2) в (1) и собирая члены одного порядка малости, получим две системы уравнений

$$\frac{d\vec{r}_0}{d\sigma} = \vec{S}_0, \quad \frac{d\left(n_0 \vec{S}_0\right)}{d\sigma} = \nabla n_0, \tag{3}$$

$$\frac{d\vec{r}_1}{d\sigma} = \vec{S}_1, \qquad \frac{d\vec{S}_1}{d\sigma} = -\frac{dn_0}{d\sigma} / n_0 \cdot \vec{S}_1 - \frac{d\left(\mu_0 \vec{S}_0\right)}{d\sigma} / n_0 + \frac{\nabla \mu_0}{n_0} + \vec{F}, \tag{4}$$

где  $\mu_0 = \mu(\vec{r}_0); \quad n_0 = n(\vec{r}_0); \quad \vec{F} = \frac{\nabla(\vec{r}_1 \nabla n_0)}{n_0} - \frac{d\left[\vec{S}_0(\vec{r}_1 \nabla n_0)\right]}{d\sigma} / n_0.$ 

Система уравнений (3) определяет траекторию луча в среде при отсутствии случайных неоднородностей. Решив её и подставив значения  $\vec{r}_0(\sigma)$  и  $\vec{S}_0(\sigma)$  в (4), получим:

$$\frac{d\vec{r}_1}{d\sigma} = \vec{S}_1, \qquad \frac{d\vec{S}_1}{d\sigma} = Q(\sigma)\vec{S}_1 + P(\sigma)\vec{f}(\sigma) + \vec{F}, \tag{5}$$

где

$$Q(\sigma) = -\frac{dn_0}{d\sigma} / n_0, \quad P(\sigma) = \frac{1}{n_0}, \quad \vec{f}(\sigma) = \nabla \mu_0 - \frac{d(\mu_0 S_0)}{d\sigma}.$$
(6)

Рассмотрим стохастическую задачу, определяемую системой дифференциальных стохастических уравнений (5) без последнего слагаемого в правой части второго уравнения системы. При учете этого члена процесс, определяемый системой (5), не является марковским, но как показано в [14], при достаточно плавной зависимости средних параметров среды от координат можно пренебречь значением этого члена в системе по сравнению с воздействием «случайной силы»  $\vec{f}(\sigma)$ . Если мы хотим ограничиться марковским процессом, необходимо сделать предположение о том, что  $\vec{f}(\sigma)$  – дельта-коррелированный случайный процесс. Тогда импульс  $\vec{P}(\sigma) = \int_{0}^{\sigma} \vec{f}(t) dt$  будет случайным процессом с независимыми приращениями. Допущение

независимости приращений справедливо при условии, что весь путь  $\sigma$  можно разбить на малые по сравнению с  $\sigma$  интервалы  $\Delta \sigma$  такие, что на пути  $\Delta \sigma$  луч испытывает много некоррелированных случайных поворотов:  $\Delta \sigma >> l$ , где l – масштаб случайной неоднородности. В то же время, отрезки  $\Delta \sigma$  должны быть достаточно малы и по сравнению с расстоянием на которых луч существенно искривляется:  $\Delta \sigma >> l_1$ , где  $l_1$  – масштаб регулярной неоднородности.

Решение второго уравнения системы (5) можно записать по компонентам в виде:

$$S_{i1} = (S_{i1})_{\sigma=0} \cdot l^{a(\sigma)} + e^{a(\sigma)} \int_{0}^{\sigma} P(u) e^{-a(u)} f_i(u) du,$$
(7)

где  $a(\sigma) = \int_{0}^{0} Q(t) dt$ .

Подставляя значения Q и P из (6) в (7) и считая для определённости, что начальное отклонение от среднего равно нулю, получим

$$S_{i1} = \frac{1}{n_0} \int_0^\sigma f_i(u) du .$$
 (8)

Из (8) легко найти моменты второго порядка для отклонений луча от среднего направления

$$\left\langle S_{i1}S_{K1}\right\rangle = \frac{1}{n_0^2} \int_0^{\sigma} \int_0^{\sigma} \left\langle f_i\left(u\right) f_K\left(u^1\right) \right\rangle du du^1.$$
<sup>(9)</sup>

В силу предположения о дельта-коррелированной случайной силе имеем

$$\left\langle f_{i}\left(u\right)f_{K}\left(u^{1}\right)\right\rangle = C_{iK}\left(u\right)\delta\left(u-u^{1}\right).$$
 (10)

Подставляя (10) в (9), получим

$$\langle S_{i1}S_{K1}\rangle = \frac{1}{n_0^2} \int_0^\sigma C_{iK}(u) du$$
 (11)

Таким образом, определение моментов второго порядка угловых отклонений сводится к нахождению коэффициентов  $C_{iK}$ , которые можно найти, проинтегрировав (10)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \langle f_i(u) f_K(u^1) \rangle du^1 = C_{iK}(u).$$
(12)

Учитывая (6), уравнение (12) можно переписать в виде

$$C_{iK} = \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x'_K} \left\langle \mu_o \mu_0^1 \right\rangle - \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{d}{du^1} \left( \left\langle \mu_0 \mu_0^1 \right\rangle S_{K0} - \frac{\partial}{\partial x'_K} \frac{d}{du} \left( \left\langle \mu_0 \mu_0^1 \right\rangle S_{i0}^1 \right) + \frac{d}{du} \frac{d}{du^1} \left( \left\langle \mu_0 \mu_0^1 \right\rangle S_{i0} S_{K0}^1 \right) \right\} du^1.$$
(13)

В силу того, что функция корреляции  $\langle \mu_0 \mu_0^1 \rangle$  заметно отлична от нуля на расстояниях порядка масштаба случайной неоднородности, искривлением луча на этом расстоянии можно пренебречь и проводить интегрирование при постоянном значении  $\vec{S}_0$ , то есть вдоль прямой.

Вводя коэффициент корреляции и относительные координаты  $x_i - x_i^1 = x_i^*$ ;  $u - u^1 = u^*$ , получим

$$C_{iK} = -\int_{-\infty}^{\infty} \left\langle \mu_0^2 \right\rangle \left\{ \frac{\partial^2 N}{\partial x_i^* \partial x_K^*} - S_{K0} \frac{\partial}{\partial x_i^*} \frac{dN}{du^*} - S_{K0} \frac{\partial}{\partial x_i^*} \frac{dN}{\partial u^*} - S_{K0} \frac{\partial}{\partial x_{K^*}} \frac{dN}{du^*} + S_{i0} S_{K0} \frac{d^2 N}{du^*} \right\} du^*.$$

$$(14)$$

Запишем уравнение прямой в относительных координатах

$$x_{i}^{*} = S_{i0}u^{*} \left(\sum_{i=1}^{3} x^{*2} = u^{*2}\right)$$
(15)

Будем считать, что среда статистически изотропна:  $N = N(u^*)$ . Опуская индекс (\*) у относительных координат, имеем

$$\frac{\partial N}{\partial x_i} = \frac{x_i}{u} \frac{dN}{du},$$

$$\frac{\partial^2 N}{\partial x_i \partial x_K} = \frac{\partial x_i}{\partial x_K} \frac{1}{u} \frac{dN}{du} - \frac{x_i x_K}{u^3} \frac{dN}{du} + \frac{x_i x_K}{u^2} \frac{d^2 N}{du^2}.$$
(16)

Учитывая (5) и (6), для первых трёх членов под интегралом получим:

$$\frac{\partial^2 N}{\partial x_i \partial x_K} = S_{i0} S_{K0} \frac{d^2 N}{du^2} + \frac{\left(\delta_{iK} - S_{i0} S_{K0}\right)}{u} \frac{dN}{du}$$

$$S_{K0} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{dN}{du} = S_{i0} \frac{\partial}{\partial x_K} \frac{dN}{du} = S_{i0} S_{K0} \frac{d^2 N}{du^2},$$
(17)

здесь  $\delta_{iK} = \frac{\partial x_i}{\partial x_K}$  – символ Кроннекера.

Подставляя выражения (17) в (14), получим:

$$C_{iK} = -\left\langle \mu_0^2 \right\rangle \left( \delta_{iK} - S_{i0} S_{K0} \right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{u} \frac{dN}{du} du$$
(18)

или

$$C_{iK} = 2(\delta_{iK} - S_{i0}S_{K0}) \cdot D, \qquad (19)$$

где *D* – коэффициент диффузии

$$D = -\left\langle \mu_0^2 \right\rangle \int_0^\infty \frac{1}{u} \frac{dN}{du} du \,. \tag{20}$$

Подставляя найденные значения коэффициентов  $C_{iK}$  в формулу для моментов второго порядка (11), получим:

$$\langle S_{iK}S_{K1}\rangle = \frac{2}{n_0^2} \int_0^{\sigma} (\delta_{iK} - S_{i0}S_{K0}) D \, d\sigma \,.$$
 (21)

Отклонения  $\vec{S} - \vec{S}_0$  подчинены нормальному закону распределения, функция распределения  $W(\vec{S}_1, \sigma)$  стандартно выражается через найденные моменты второго порядка (21). Переходя в пространстве  $\vec{S}_1$  к сферическим координатам, легко получить угловое распределение  $W(\theta_1, \phi_1, \sigma)$ .

Представляет интерес найти значение среднего квадрата угла отклонения луча от регулярного направления. При малых углах квадрат угла отклонения от регулярного направления  $\vec{S}_0$  определяется квадратом перпендикулярной к  $\vec{S}_0$  составляющей вектора  $\vec{S}_1$ . Учитывая, что  $|\vec{S}_0| = 1$  имеем

$$\vec{S}_{\perp} = \vec{S}_{1} - \vec{S}_{0} \left( \vec{S}_{0} \vec{S}_{1} \right).$$
(22)

Откуда

$$\left\langle \varepsilon^{2} \right\rangle = \left\langle \vec{S}_{1}^{2} \right\rangle - \left\langle \left( \vec{S}_{0} \vec{S}_{1} \right)^{2} \right\rangle.$$
(23)

Используя (21), найдём  $\left< \vec{S}_1^2 \right>$  и  $\left< \left( \vec{S}_0 \vec{S}_1 \right)^2 \right>$ 

$$\left\langle \vec{S}_{1}^{2} \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{3} S_{i1}^{2} \right\rangle = \frac{2}{n_{0}^{2}} \int_{0}^{\sigma} \sum_{i=1}^{3} \left( \delta_{ii} - S_{i0}^{2} \right) d\sigma = \frac{4}{n_{0}^{2}} \int_{0}^{\sigma} D \, d\sigma$$
 (24)

$$\left\langle \left(\vec{S}_{0}\vec{S}_{1}\right)^{2} \right\rangle = \left\langle \left(\sum_{i=1}^{3} S_{i0}S_{i1}\right)^{2} \right\rangle =$$

$$= \frac{2}{n_{0}^{2}} \sum_{i=1}^{3} \sum_{K=1}^{3} S_{i0}S_{K0} \int_{0}^{\sigma} \left(\delta_{iK} - S_{i0}S_{K0}\right) D \, d\sigma =$$

$$= \frac{2}{n_{0}^{2}} \left[ \int_{0}^{\sigma} D \, d\sigma - \sum_{i=1}^{3} \sum_{K=1}^{3} S_{i0}S_{K0} \int_{0}^{\sigma} S_{i0}S_{K0} D \, d\sigma \right].$$
(25)

Подставляя (24) и (25) в (23) для среднего квадрата угла отклонения от регулярного направления распространения получим формулу

$$\left\langle \varepsilon^{2} \right\rangle = \frac{2}{n_{0}^{2}} \left[ \int_{0}^{\sigma} D \, d\sigma + \sum_{i=1}^{3} \sum_{K=1}^{2} S_{i0} S_{K0} \int_{0}^{\sigma} S_{i0} S_{K0} D \, d\sigma \right].$$
 (26)

Значения компонент средней скорости  $S_{i0}(\sigma)$  и  $S_{K0}(\sigma)$ , как отмечалось выше, определяется из численного интегрирования бихарактеристической системы уравнений для регулярного луча.

В отсутствии регулярной рефракции, когда среднее направление луча не меняется, вынося произведение  $S_{i0}S_{K0}$  из-под интеграла и учитывая, что  $|\vec{S}_0|=1$ , для среднего квадрата угла отклонения получим известную формулу [4]

$$\left\langle \varepsilon^2 \right\rangle = \frac{4D}{n_0^2} \sigma \,.$$
 (27)

В случае нормального падения на неоднородный слой  $\vec{S}_0 = (0, 0, S_{0z})$  причем  $S_{0z} = 1$ , имеем

$$\left\langle \varepsilon^{2} \right\rangle = \frac{4}{n_{0}^{2}(z)} \int_{0}^{z} Ddz.$$
 (28)

Формула (28) с учетом различия в коэффициенте диффузии, совпадает с полученной в работе [9]. Вдоль лучевой траектории бихарактеристической системы средний квадрат угла отклонения луча от регулярного направления в трёхмерном случае можно записать в виде

$$\left\langle \varepsilon^{2} \right\rangle = \frac{2c}{n_{0}^{2}} \left\{ \int_{0}^{t} Dn_{0} dt + \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \cos \phi_{i} \cos \phi_{j} \times \int_{0}^{t} D \cdot n_{0} \cos \phi_{i} \cos \phi_{j} \cdot dt \right\},$$
(28')

где  $\phi_{ij}$  - углы направляющих косинусов луча, C – скорость света, а t – групповое время распространения сигнала.

В двумерном случае полная система уравнений для численного расчета  $\langle \varepsilon^2 \rangle$  в ионосфере имеет вид:

$$\frac{dr}{dt} = cn_0(r,\theta)\cos\phi,$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{cn_0(r,\theta)}{r}\sin\phi,$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{c}{r^2}\frac{\partial(n_0r)}{\partial\theta}\cos\phi - \frac{c}{r}\frac{\partial(n_0r)}{\partial r}\sin\phi,$$

$$\langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{c}{r^2} \left\{ \int_0^t 3D \cdot n_0 dt + \cos 2(\phi+\theta) \int_0^t Dn_0 \cos 2(\phi+\theta) dt + \sin 2(\phi+\theta) \int_0^t Dn_0 \sin 2(\phi+\theta) dt \right\}.$$
(29)

Численное интегрирование бихарактеристической системы позволяет получить зависимость среднего квадрата угла отклонения луча  $\langle \varepsilon^2 \rangle$  для любой глобально неоднородной модели ионосферы.

На рис. 1, в качестве примера, приведены графики зависимости среднего квадрата угла отклонения луча от высоты для различных углов выхода  $\phi_0$ . Модельный расчет проводился для сферически-слоистой модели ионосферы с бипараболической зависимостью электронной концентрации от высоты при следующих параметрах однослоевой модели:  $h_{max} = 300 \kappa M$  (высота максимума слоя),  $f_0/f_{pab} = 0,3$ , D = const.

## Средний квадрат смещения луча

Проинтегрировав второе уравнение системы (5), мы определили угловые отклонения луча от регулярного направления. Интегрируя первое уравнение этой системы, можно найти пространственные отклонения

$$r_{i1} = \int_{0}^{0} S_{i1} d\sigma \,. \tag{30}$$

Компоненты вектора  $\vec{S}_1$  определяются формулой (18), тогда

$$r_{i1} = \int_{0}^{\sigma} \frac{1}{n_0(u)} \int_{0}^{u} f_i(t) dt du.$$
(31)

Интегрируя по частям, получим

$$r_{i1} = \int_{0}^{\sigma} f_{i}(u) du \cdot \int_{0}^{\sigma} \frac{dt}{n_{0}(t)} - \int_{0}^{\sigma} \int_{0}^{u} \frac{dt}{n_{0}(t)} f_{i}(u) du =$$
  
= 
$$\int_{0}^{\sigma} [L(\sigma) - L(u)] f_{i}(u) du,$$
 (32)

где  $L(u) = \int_{0}^{u} \frac{dt}{n_0(t)}$  – групповой пусть в плазме.



Рис. 1. Зависимость среднего квадрата угла отклонения луча от высоты для различных углов выхода луча из точечного источника

Для моментов второго порядка имеем

$$\left\langle r_{i1}r_{K1}\right\rangle = \int_{0}^{\sigma} \int_{0}^{\sigma} \left[ L(\sigma) - L(u) \right] \left[ L(\sigma) - L(u') \right] \left\langle f_{i}(u) f_{K}(u') \right\rangle du du'.$$
(33)

Учитывая (10) и интегрируя один раз, получим

$$\langle r_{i1}r_{K1} \rangle = \int_{0}^{0} \left[ L(\sigma) - L(u) \right]^{2} C_{iK}(u) du$$
 (34)

Коэффициенты  $C_{iK}$  определяются по формуле (19).

Найдём средний квадрат полного смещения луча

$$\left\langle \rho^{2} \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{3} r_{i1}^{2} \right\rangle = 4 \int_{0}^{\sigma} \left[ L(\sigma) - L(u) \right]^{2} D \, du \,.$$
 (35)

Для случая плоскослоистой среды аналогичный результат был получен в [15]. Для горизонтально-неоднородной ионосферы с учетом её сферичности из (35) получим зависимость среднего квадрата полного смещения луча вдоль групповой траектории, определяемой при численном решении системы (29) в виде:

$$\left\langle \rho^{2} \right\rangle = 4c^{3} \left\{ t^{2} \int_{0}^{t} Dn_{0} dt - 2t \int_{0}^{t} Dtn_{0} dt + \int_{0}^{t} Dt^{2} n_{0} dt \right\}$$
 (35')

Графики зависимости среднего квадрата смещения луча от высоты для различных углов выхода  $\phi_0$  и сферически-слоистой модели ионосферы приведены на рис. 2. Параметры модели ионосферы те же, что и на рис. 1.



Рис. 2. Зависимость среднего квадрата смещения луча от высоты для различных углов выхода

Область применимости полученных результатов ограничивается условиями применимости геометрической оптики для расчета статистических характеристик поля при учете регулярной рефракции [19]

$$\lambda \ll l; \ \lambda L \ll l^2, \tag{36}$$

где  $\lambda$  – длина волны, l – масштаб случайной неоднородности, L – групповой путь луча в плазме. Кроме этого, предположение о марковости процесса распространения луча влечёт за собой требование плавности изменения средних характеристик среды

$$l \ll l_1, \tag{37}$$

где 
$$l_1 = \frac{n_0}{|\nabla n_0|}$$
 – характерный масштаб изменения регулярной неоднородности.

#### Выводы

В заключении ещё раз отметим, что средние характеристики луча  $\vec{S}_0(\sigma)$  и  $L(\sigma)$ , входящие в выражения (21), (26), (34), (35) определяются из системы уравнения для регулярного луча (29). Таким образом, расчет флуктуации параметров луча в трехмерно неоднородной среде сводится к расчету траекторий в регулярно неоднородной среде. При зависимости характеристик среды более чем от одной координаты система (29) может быть решена лишь численным методом.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-12-00299.

#### Литература

1. Казанцев А.Н., Лукин Д.С., Спиридонов Ю.Г. Метод исследования распространения радиоволн в неоднородной магнитоактивной ионосфере. // Космические исследования, 1967. Т. 5. Вып. 4. С. 593–600.

2. Крюковский А.С., Лукин Д.С., Кирьянова К.С. Метод расширенной бихарактеристической системы при моделировании распространения радиоволн в ионосферной плазме. // Радиотехника и электроника, М.: Наука. 2012. Т.57. № 9. С. 1028–1034.

3. Эйнштейн А., Смолуховский М., Броуновское движение. ОПТИ, 1936. С. 148.

4. Чернов Л.А. Распространение волн в среде со случайными неоднородностями. М.: АН СССР, 1958. С. 159; ЖЭТФ, 1953. Т.24. № 2.

5. Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику. М.: Наука, 1966. 403 с.

6. Рытов С.М. Дифракция света на ультразвуковых волнах. // Изв. АН СССР. Сер. физич. 1937. № 2. С. 223.

7. Власова О.К., Гусев В.Д. Флуктуации направления распространения электромагнитных волн в турбулентной гиротропной среде. // Геомагнетизм и аэрономия. 1969. № 5.

8. Власова О.К., Гусев В.Д. Статистика лучей в однородной изотропной турбулентной среде с эллипсоидальными неоднородностями. // Геомагнетизм и аэрономия, 1971. № 3; 1971. № 4.

9. Денисов Н.Г. Рассеяние воли в плоскослоистой среде. // Изв. вузов. Радиофизика, 1958. Т. 1. № 5-6. С.34.

10. Денисов Н.Г. О флуктуациях амплитуды и фазы волны, прошедшей через слой со случайными неоднородностями. // Изв. вузов. Радиофизика, 1959. Т.2. №2. С. 316.

11. Денисов Н.Г. Дифракция электромагнитных волн в гиротропном слое, содержащем статистические неоднородности. // Изв. вузов. Радиофизика, 1960. Т. З. №3. С.393; 1960. Т.З. № 4. С. 619.

12. Денисов Н.Г. О влиянии области отражения на рассеяние радиоволн в ионосфере. // Изв. вузов. Радиофизика, 1960. Т. З. №2. С.208.

13. Денисов Н.Г. О рассеянии волн в условиях полного отражения. // Изв. вузов. Радиофизика, 1964. Т. 7. С.378.

14. Комиссаров В.М. // Изв.вузов. Радиофизика, 1966. Т.9. № 2. С.292.

15. Комиссаров В.М. Кандидатская диссертация. М.: Акустический институт АН СССР. 1966.

16. Гусев В.Д. Рассеяние волн в неоднородном турбулентном слое в геометрооптическом приближении. // Радиотехника и электроника, 1973. Т.18. № 12.

17. Голынский С.М., Гусев В.Д. Статистика лучей в неоднородной изо фон ной среде. // Радиотехника и электроника, 1976. Т.21. № 3. С.630.

18. Голынский С.М., Гусев В.Д. Траектории лучей в рефрагирующей рассеивающей среде. // Радиотехника и электроника. 1976. Т.21. № 6. С.1303.

19. Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1967, 548 с.

20. Татарский В.И. Распространение коротких волн в среде со случайными неоднородностями в приближении марковского случайного процесса. Препринт ООФАГ АН СССР, М., 1970.

21. Татарский В.И. Распространение света в среде со случайными неоднородностями показателя преломления в приближении марковского случайного процесса. // ЖЭТФ, 1969. Т. 56. С. 2106.

22. Кляцкин В.И., Татарский В.И. О приближении параболического уравнения в задачах распространения волн в среде со случайными неоднородностями. // ЖЭТФ, 1970. Т.58, С. 624.

23. Кляцкин В.И., Татарский В.И. Новый метод последовательных приближений в задаче о распространении волн в случайных средах. // Изв. вузов. Радиофизика, 1971, Т. 14, С. 1400.

24. Кляцкин В.И. О пределах применимости приближения марковского случайного процесса в задачах, связанных с распространением света в среде со случайными неоднородностями показателя преломления. // ЖЭТФ, 1969. Т.57, С. 25.